

즉각 발표 자료

투자자 홍보:

Ed Lockwood

수석 이사, 투자자 홍보 담당

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

매체 홍보:

Becky Howland, 박사

수석 이사, 기업 커뮤니케이션 담당

(408) 875-9350

becky.howland@kla-tencor.com

KLA-Tencor, 광학 및 EUV 레티클 블랭크 검사용 최신 FlashScan™ 제품군 발표

캘리포니아주 밀피타스, 2017년 8월 15일—[KLA-Tencor Corporation](#)(NASDAQ: KLAC)에서는 오늘 신형 FlashScan™ 레티클 블랭크* 검사 제품군을 발표했습니다. KLA-Tencor는 1978년 처음으로 검사 시스템을 도입한 이래로 패턴 레티클 검사 분야에서 중대한 역할을 해왔지만, 새로 출시된 FlashScan 제품군은 레티클 블랭크 검사 전용 제품 시장으로 진출한다는 데에 그 의미가 있습니다. 레티클 블랭크 검사 시스템은 블랭크 제조업체에서 공정 개발 및 양산 과정 중에 결함 관리를 위해 구매하며, 레티클 제조업체("마스크 습")에서 예정된 검사 시행, 툴 모니터링 및 공정 제어의 용도로 구매하고 있습니다. FlashScan 시스템은 광학 또는 극자외선(EUV) 노광용으로 고안한 레티클 블랭크를 검사할 수 있습니다.

"발전적 노광(Advanced lithography)은 잘 특성화한 레티클 블랭크부터 시작하는 법입니다."라고 KLA-Tencor의 레티클 및 광대역 웨이퍼 검사 부문 전반 관리자인 Yalin Xiong 박사는 말했습니다. "결함이 없는 EUV 블랭크는 제조하기 극히 까다롭기로 악명이 높습니다. 비용도 많이 들고, EUV 노광이 차세대 칩 제조에 가져다줄 수 있는 여러 가지 이점을 누릴 수 있는 시점이 늦춰지고 있습니다. KLA-Tencor의 신형 FlashScan 블랭크 검사기는 빈 기판, 흡수층(absorber film) 및 감광 코팅면 등에 존재하는 광범위한 결함 유형을 포착할 수 있습니다. 또한, FlashScan 시스템은 현재 시중에서 구할 수 있는 다른 시스템에 비해 처리량과 감도가 월등한 것이 특징으로 블랭크 제조업체와 마스크 습 측면에서는 학습 주기의 속도가 빨라지는 효과도 있습니다."

FlashScan 시스템은 KLA-Tencor의 웨이퍼 결함 검사 포트폴리오 특유의 레이저 산란 기술을 활용하여 현재 생산 또는 개발 중인 여타 모든 광학 및 EUV 블랭크의 감도와 속도 요구사항에 부합합니다. 레티클 검사 시장에서 유일무이한 3 채널 컬렉터는 감광 코팅면의 핀홀이나 블랭크 제조 또는 운송 도중에 나타날 수 있는 떨어진(fall-on) 입자 등과 같은 여러 가지 유형의 레티클 블랭크 결함을 감지하여, 크기를 알아내고 구별할 수 있도록 고안되었습니다.

업계를 선도하는 마스크 습 고객들로부터 강한 관심을 표출하고 있는 것이 시장에 광범위한 결함 유형 포착 기능이 있는 고감도, 고생산성 시스템에 대한 수요가 있다는 점을 입증하고 있습니다. FlashScan 시스템은 블랭크 및 패턴 레티클 제조업체에서 요구하는 높은 성능과

생산성을 유지하기 위해 [KLA-Tencor의 글로벌 종합 서비스 네트워크](#)를 통해 지원됩니다. 최신 모델에 대한 설명을 포함한 신제품 FlashScan 제품군에 대한 자세한 정보는 [FlashScan 웹페이지](#)에서 확인하실 수 있습니다.

KLA-Tencor 정보:

세계 선두의 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 제공업체인 KLA-Tencor Corporation은 전 세계 고객과 협력 관계를 맺고 최첨단 검사 및 계측 기술을 개발하고 있습니다. 이러한 기술은 반도체 및 다른 관련 나노전자 산업에 기여합니다. 이 회사는 업계 표준의 제품 포트폴리오와 세계적인 엔지니어 및 과학자 팀을 보유하고 있으며 40년 동안 고객을 위한 최고의 솔루션을 만들어 왔습니다. 캘리포니아 밀피타스에 본사를 둔 KLA-Tencor는 전 세계에서 고객 운영과 서비스 센터에 전념해왔습니다. 자세한 정보는 www.kla-tencor.com(KLAC-P)에서 확인하실 수 있습니다.

미래 예측 기술:

본 보도 자료에 기재된 기술문 중 FlashScan 시스템의 예상 성능과 관련된 내용 및 EUV 노광에 레티클 블랭크 결함 감소가 미치는 영향과 같은 기술은 과거의 사실을 제외 미래 예측 기술이며, 이는 1995년 증권 민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에서 제정된 면책조항(Safe Harbor provisions)을 따릅니다. 이러한 미래 예측 기술은 현재의 정보와 기대치에 근거하며, 많은 위험과 불확실성을 담고 있습니다. (비용, 성능 또는 기타 문제로 인한) 신기술 채택 지연, 다른 회사에 의한 경쟁 제품의 출시, KLA-Tencor 제품의 이행, 성능 또는 사용에 영향을 주는 예기치 않은 기술적 난제나 제한 사항 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 그러한 기술에서 예측된 것과 크게 다를 수 있습니다.

*레티클 블랭크(Reticle blanks)는 레티클 패턴을 작성하는 복합 기판을 의미합니다.

###